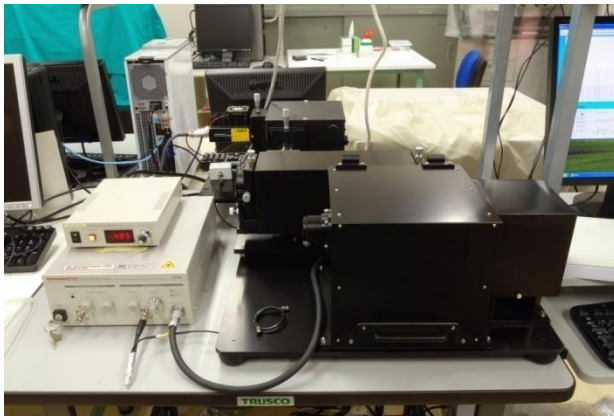


低価格ナノ/ピコ秒蛍光寿命計測装置 L-FLTシリーズ

provisional



L-FLTシリーズは、サンプルの蛍光寿命をナノ秒またはピコ秒の時間分解能で計測するシステムです。ナノ秒はオシロスコープ、ピコ秒はTAC(Time-to-Amplitude Converter)法による精度の高い計測を行います。
また、波長はフィルター式固定タイプと分光器によるスキャンタイプが選択出来ます。
低価格な装置構成でご提案させていただきます。

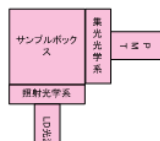
システムのご提案

光源及び検出器(波長タイプ)と信号処理部(時間分解能)をキーワードに、シンプルに構成出来ます。

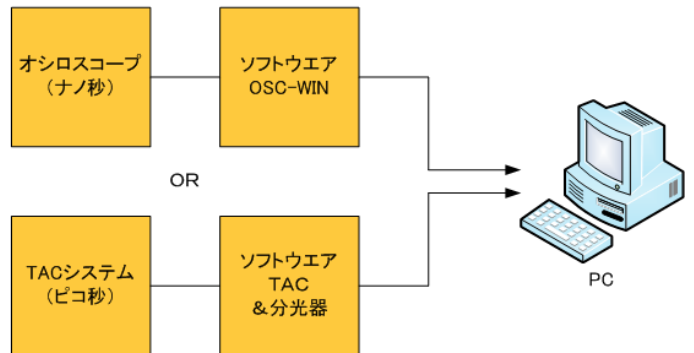
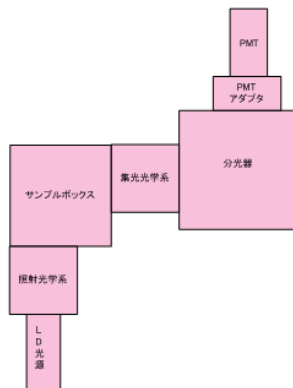
= 光源及び検出部 =

= 信号処理部 =

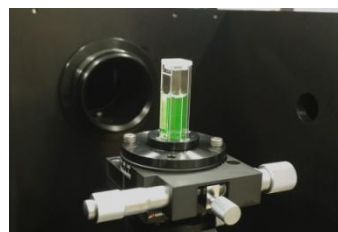
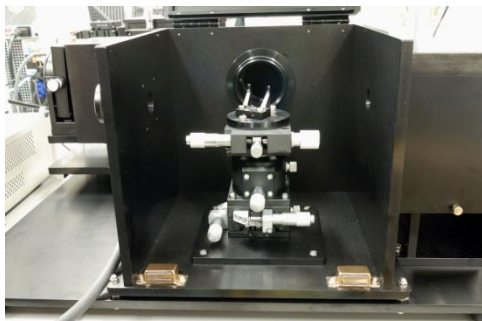
高感度タイプ(固定波長)



波長スキャンタイプ



サンプルホルダー一部

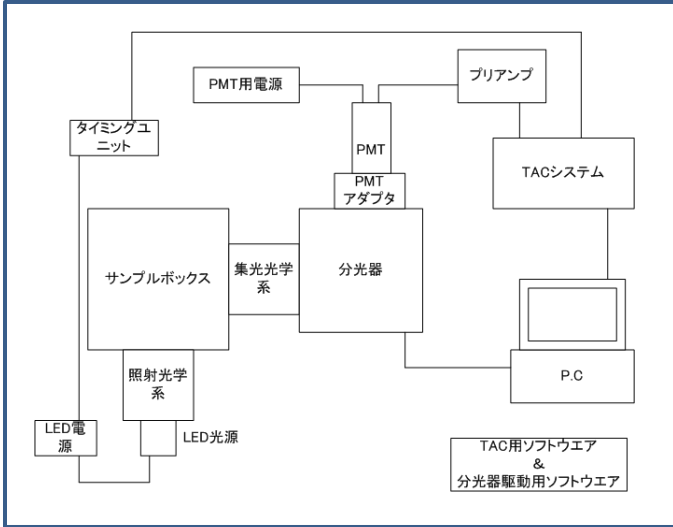


セルホルダー取付例

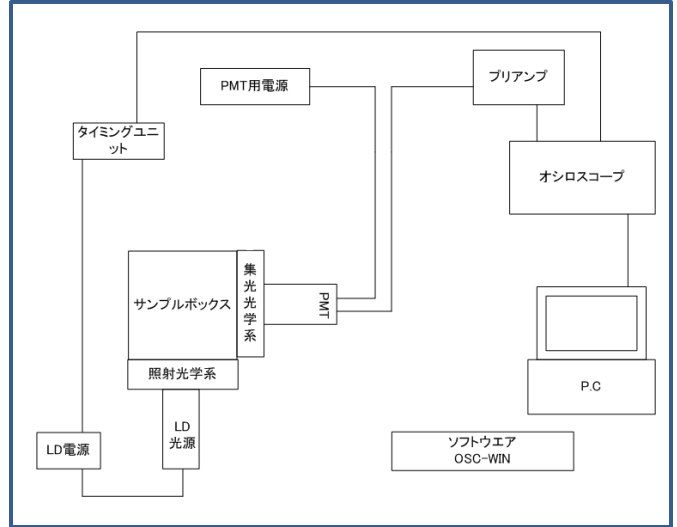
固体・液体・粉体等様々なサンプルに対応します。

低価格ナノ/ピコ秒蛍光寿命計測装置 L-FLTシリーズ

provisional



波長スキャンピコ秒システム例



高感度ナノ秒システム例

主たる構成は、光源、照射用光学系、サンプルボックス、集光光学系、分光器（波長スキャンタイプ）からなります。用いられる光学系はすべて反射型であり、紫外光から赤外まで色収差なく測定が可能です。本ユニットは、高速で微弱な蛍光寿命計測をよりシンプルに安定測定するために開発された研究用途の光学ユニットです。本装置の出射スリットにご用途に合った検出器を装着することで、幅広い波長範囲で測定が可能です。

* 仕様（波長スキャンタイプ）

- ・励起波長 : 473nm他各種有り
- ・励起波長公差 : $\pm 10\text{nm}$
- ・パルス幅 : 180ps max
- ・波長分解能 : 0.125nm @ 10um Slit, 1200g/mm 使用時
- ・測定波長範囲 : 0~1400nm @ 1200g/mm 使用時
- ・測定波長駆動 : PC制御 (RS232 または USB)
- ・光学系 : 色収差フリー&高効率タイプ (イメージングタイプはオプション)
- ・サンプルボックス : サンプルは垂直配置
溶液・固体・粉体サンプルに対応
クライオスタット設置増設可能



製造元
株式会社ルシール
本社

〒300-2667 茨城県つくば市中別府580-4
ラボ&オフィス
〒300-2667 茨城県つくば市中別府601-3
TEL:029-848-3030 FAX:029-848-3031
大阪オフィス
〒560-0012 大阪府豊中市上野坂2-3-12
TEL:06-6335-7600 FAX:06-6335-7601



販売代理店